

<<数字电路实验教程>>

图书基本信息

书名：<<数字电路实验教程>>

13位ISBN编号：9787560726984

10位ISBN编号：7560726984

出版时间：2003-12

出版时间：山东大学出版社

作者：南新志

页数：126

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<数字电路实验教程>>

内容概要

实验教学的目的不仅是验证已知的理论，训练学生的基本实验技能，更重要的是要培养学生具有科研能力和探索精神。

本书编写的宗旨是：根据教学的基本要求，在实验方法和设计能力方面对学生进行全面的培养。做到适应性强、便于学生阅读、有利于学生的能力培养和因材施教。

本书共分五大部分。

第1章为第一部分，本章主要介绍了数字电路实验中器件的使用规则，实验时布线、故障排除的方法和注意事项以及常用仪器的使用方法。

第2章为第二部分，由于《数字电路》课程是学习《电子设计自动化》和《单片机原理》等课程的基础，所以本章只介绍了可编程器件GAL的基本原理和开发的方法及步骤，在系统可编程技术以及现场可编程器件的应用将在后续课程中进行学习。

第3章为第三部分，本章根据理论课的学习顺序，给出了21个实验一课题，这些实验课题中既有验证性实验，也有设计性实验，每个实验都有多项实验内容，可供不同层次和不同实验学时的使用者进行选择。

第4章为第四部分，本章为综合实验部分，给出了几个综合性的数字系统实验课题，用来培养学生运用秘学的知识进行综合设计数字系统的能力。

附录1和附录2为第五部分，本部分整理汇编了近200余种数字集成电路的型号、外引线功能图、部分逻辑符号和功能表以及TTL和CMOS集成电路的主要性能参数供读者参考，这部分相当于袖珍速查手册，对使用者提供了很大的方便。

<<数字电路实验教程>>

书籍目录

第1章 实验基本知识 集成电路的命名规则 逻辑图形符号 TTL集成电路与CMOS集成电路的使用规则
实验电路布线及常见故障的检查与排除 常用仪器第2章 可编程逻辑器件GAL及应用 PLD的基本概念
及发展过程 通用阵列逻辑GAL PLD开发的基本步骤 PLD的开发工具 几个GAL应用实例第3章 基本实
验 常用仪器的使用及与非门的功能测试 逻辑门外特性的测试 OC门与三态门逻辑功能的测试及应用
组合电路设计实验之一 组合电路设计实验之二 中规模组合电路设计之一 中规模组合电路设计之二
七段显示译码器 竞争冒险现象的观察与排除 锁存器、触发器逻辑功能测试及相互转换 用触发器设计
同步计数器 用触发器设计节拍发生器和序列信号发生器 用触发器设计异步计数器 集成计数器的功能
测试及应用 用集成计数器设计序列信号发生器及节拍发生器 移位寄存器功能测试及应用 555定时器
D/A转换器 A/D转换器 GAL实验之一 GAL实验之二第4章 数字系统实验 三位数字频率计 简易计算器
三人抢答器 带有校的功能的数字闹钟附录1 集成电路主要性能参数附录2 部分常用数字集成电路选编
参考文献

<<数字电路实验教程>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>